

△の数		訂正記事	設計	検図	年月日	△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△	1	DIS-H-03768 (06159)	梅原		24.03.29	△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		- 3 5℃～+ 8 5℃(注 1)				保存温度範囲		- 1 0℃ ～+ 6 0℃		
	電 圧		A C 2 5 0 V				適合コネクタ		D F 1 B - 1 4 D S - 2 . 5 R C		
	電 流		AWG20～24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A								
性 能											
	項 目		試 験 方 法				規 格			QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。			○	○
	表 示		目視にて確認する。							○	○
電氣的性能	低電圧、低電流下の接触抵抗		100mA (DC又は1000 Hz)で測定する。				30 mΩ以下			○	—
	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定する。				1000 MΩ以上			○	—
	耐 電 圧		AC 650 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機械的性能	繰り返し動作		30 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐 振 性		周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅0.75mmで3方向 各2時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐 衝 撃 性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃, 湿度 90～95% 中に96 時間放置する。				① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 △ ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	温度サイクル		温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分を 5 サイクル試験する。				① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	はんだ耐熱性		【70-半田付けの場合】 はんだ温度 260℃, 5 秒間で試験する。 【手半田付けの場合】 はんだこて温度 300℃, 3秒で試験する。 但し、端子に力を加えないこと。				外観の変形及び端子などの著しいガタがないこと。			○	—
	はんだ付け性		はんだ温度 235℃, 浸漬時間 5 秒間のはんだ付けを行う。				半田浸せき面の 95% 以上が新しいはんだでぬれていること。			○	—
備考 (注 1)通電による温度上昇を含む。							製 図	設 計	検 図	承 認	出 図
							NC	NC	NC	NC	
							'03.04.02	'03.04.04	'03.04.23	'03.04.23	
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5024を適用している。							松木	伝法谷	宮崎	宮崎	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表			製品名 D F 1 B Z - 1 4 D P - 2 . 5 D S A			
旧CL			図番			製品コード			1		
CL			SLC4-301803-00			CL541-2022-0			1		